

計測分析に関する講演会 「静電気試験法及びプリント基板ノイズ対策技術」

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:(公財)科学技術交流財団、愛知工研協会

あいち産業科学技術総合センターでは、高度計測分析機器を用いた分析・評価により、企業の方々の新技術・新製品開発への取組みや現場の課題解決を支援しています。

このたび、電磁環境試験に携わる技術者に関心の高い「EMC規格及び試験方法」と「電磁ノイズ対策技術」に焦点をあてた計測分析に関する講演会を、10月14日(金)に当センターにて開催します。電子機器には、意図しない電磁ノイズの発生を抑えるとともに、電磁ノイズを受けても誤動作を起こさないような対策が求められます。1つ目の講演では、静電気試験について、静電気の発生メカニズム及びEMC規格による静電気の試験方法について説明します。2つ目の講演では、プリント基板の設計からみた電磁ノイズ対策技術について、プリント基板設計をする上で、EMC性能を考慮した設計手法を、事例を交えて紹介します。

講演後には、当センターの分析機器及び隣接するあいちシンクロトロン光センターの見学会を行います。

多くの皆様の御参加をお待ちしております。

【日 時】平成28年10月14日(金) 午後1時30分～午後5時

【場 所】あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8316

東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ

【プログラム】

時間	内容
13:00 ~ 13:30	受付
13:30 ~ 14:30	「EMC規格 IEC 61000-4-2 による静電気試験」 一般社団法人 KEC 関西電子工業振興センター 試験事業部 事業部長 <small>まさおか けんじ</small> 正岡 賢治氏
14:30 ~ 14:40	休憩
14:40 ~ 16:30	「EMCを考慮したプリント基板設計」 三菱電機エンジニアリング株式会社 EMC東日本センター 東日本EMC技術課長 <small>ほった まさし</small> 堀田 雅志氏
16:30 ~ 17:00	見学会 (希望者のみ) ・あいち産業科学技術総合センター (計測分析室、試作評価室を中心に) ・あいちシンクロトロン光センター

■ **申込方法** 下記の申込書に御記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成28年10月12日(水)

■ **参加費** 無料

■ **定員** 80名(先着順)

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター
 共同研究支援部 試作評価室 浅井、加藤(淳)
 〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1
 電話：0561-76-8316 FAX：0561-76-8317
 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp
 URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会「静電気試験法及びプリント基板ノイズ対策技術」
 参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 試作評価室 浅井、加藤(淳) 宛
 FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX
	メールアドレス
見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい)	参加 不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめ御了承ください。

※受講票は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。